## Гистерезисные свойства двухмерной структуры доменных границ в магнитно-трехосных пленках с плоскостью поверхности (110)

## © М.Н. Дубовик, Б.Н. Филиппов

05

Институт физики металлов, Екатеринбург E-mail: dubovik@imp.uran.ru

## Поступило в Редакцию 27 декабря 2013 г.

На основе численного микромагнитного моделирования исследована перестройка во внешнем магнитном поле структуры двухвихревой асимметричной доменной границы в ферромагнитной пленке с кубической анизотропией. Пленка имела госсовскую ориентацию поверхности (поверхность типа (110)). Обнаружен существенный гистерезис перестройки структуры доменной границы и связанный с ним гистерезис перемагничивания в поле, перпендикулярном оси легкого намагничивания.

Наличие в магнитно-упорядоченных средах областей с существенно неоднородным распределением намагниченности является фундаментальным свойством, связанным с наличием у реальных тел поверхности и дальнодействующего диполь-дипольного взаимодействия. Изучение неоднородных конфигураций намагниченности в рамках двух- и трехмерных моделей является на данный момент активно рассматриваемой задачей. К таким конфигурациям относятся, в частности, области доменных границ, свойства которых оказывают значительное влияние на практически важные характеристики магнитных материалов. Наиболее сложной структурой обладают доменные стенки в объектах ограниченных размеров, таких как тонкие пленки или пленки-полоски, актуальность изучения которых связана с возможностью их применения в устройствах хранения и обработки информации. В частности, в пленках с осью легкого намагничивания (ОЛН), параллельной поверхности, предсказано и экспериментально подтверждено существование асимметричных вихреподобных доменных границ [1-3]. Вихревое распределение намагниченности внутридоменной стенки может смещаться

15



**Рис. 1.** Геометрия задачи. Показаны кристаллографические направления типа (100), являющиеся осями легкого намагничивания. Плоскость пленки является плоскостью (110).

и перестраиваться под влиянием внешних воздействий. Примером может служить нелинейная динамическая перестройка вихреподобной стенки при ее движении во внешнем поле, параллельном ОЛН [3]. Во внешнем магнитном поле, направленном перпендикулярно к ОЛН, лежащей в плоскости пленки, структура неподвижной доменной границы также изменяется. В [3,4] изучалась происходящая при такой геометрии задачи перестройка вихреподобной стенки в двухмерную неелевскую при достижении полем определенной величины. С этим связан гистерезис при перемагничивании в направлении, перпендикулярном ОЛН [3]. Однако следует заметить, что толщина пленки и характер магнитной анизотропии могут существенно менять исходную равновесную структуру доменной стенки. Так, в магнитно-трехосных пленках с госсовской ориентацией поверхности при толщинах порядка нескольких сотен нанометров стабильными становятся структуры не с одним, а с несколькими вихрями (так называемые цепочечно-вихревые структуры [5,6]). Перестройка данных структур во внешнем поле, перпендикулярном ОЛН, до сих пор не рассматривалась. В данном сообщении исследована такая перестройка для толщины трехосной пленки, соответствующей стенке с двумя вихрями.

Геометрия задачи иллюстрируется рис. 1. Одна из ОЛН пленки с кубической анизотропией параллельна поверхности пленки и сонаправлена с осью z декартовой системы координат, другие две наклонены к поверхности под углами 45 и 135° (госсовская ориентация поверхно-

сти). Ось у перпендикулярна поверхности пленки. Исходное состояние пленки соответствует двум доменам, намагниченным вдоль  $\pm z$  со 180-градусной стенкой, сосредоточенной в некоторой области V в форме параллелепипеда (расчетной области). Считается, что размер пленки в направлении z велик и намагниченность **M** в расчетной области зависит от координат x и y (двухмерная модель распределения намагниченности). Равновесные распределения  $\mathbf{M}(x, y)$  рассчитываются из минимизации функционала полной энергии доменной границы, который в расчете на единицу длины вдоль оси z имеет вид

$$W = \iint_{D} \left\{ A \left[ \left( \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial x} \right)^{2} + \left( \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial y} \right)^{2} \right] + K \left[ m_{x}^{2} m_{z}^{2} + m_{y}^{2} m_{z}^{2} + \frac{1}{4} \left( m_{y}^{2} - m_{x}^{2} \right)^{2} \right] - \frac{1}{4} \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}^{m} - \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} \right\} dx dy,$$
(1)

где D — сечение области V плоскостью xy. Слагаемые под знаком интеграла представляют собой плотности обменного, магнитноанизотропного, диполь-дипольного и зеемановского взаимодействий соответственно.  $\mathbf{m} = \mathbf{M}/M_S$ , поле  $\mathbf{H}^m$  определяется из решения уравнений магнитостатики с обычными граничными условиями, внешнее поле Н направлялось вдоль оси х. Использовались следующие значения параметров материала: обменный параметр  $A = 2 \cdot 10^{-11}$  J/m, константа кубической анизотропии  $K = 5.2 \cdot 10^4 \, \text{J/m}^3$ , намагниченность насыщения  $M_S = 1.74 \cdot 10^6$  А/т. Данные величины близки к параметрам пленок железа. Для выполнения минимизации (1) расчетная область разбивается на ячейки с квадратным сечением в области D со стороной размером порядка размера однодоменности. Это позволяет считать, что намагниченность в каждой ячейке однородна и меняется при переходе между ячейками. В соответствии с этим (1) дискретизируется. Более подробные сведения о методах расчета, граничных условиях, выборе размера расчетной области по оси x и т. п. могут быть найдены в [1,3-6].

Рассматривалась толщина пленки 250 nm (размер расчетной области по оси *y*). При H = 0 и заданных параметрах стабильным типом доменной границы будет стенка с двумя вихрями, иллюстрируемая рис. 2, *a* (см. также в [5]). Вихри имеют противоположные киральности и расположены друг над другом по разные стороны от центральной поверхности стенки (поверхности уровня  $m_z = 0$ ). При включении



**Рис. 2.** Равновесные распределения намагниченности в области D, соответствующие значениям H = 0 (a), 180 Oe (b), -100 Oe (c). Стрелками показаны проекции **m** на плоскость xy. Изменение цвета фона от светлого к темному соответствует смене знака *z*-компоненты намагниченности. Таким образом, линией раздела между цветами обозначено сечение поверхности уровня  $m_z = 0$  плоскостью xy.

H(H, 0, 0) структура стенки перестраивается. При этом учитывается поворот намагниченности в доменах, подробнее о способе учета см. в [4]. Было показано, что перестройка происходит различным образом в зависимости от знака H. Если внешнее поле ориентировано в положительном направлении оси x, то происходит смещение каж-

дого вихря намагниченности в направлении домена, ориентация **М** в котором соответствует таковой в центре соответствующего вихря. При этом центральная поверхность стенки наклоняется так, что возрастает усредненная по объему расчетной области проекция намагниченности на направление внешнего поля  $\langle m_x \rangle$ . С ростом величины *H* наклон поверхности  $m_z = 0$  увеличивается и вихри становятся все менее ярко выраженными и постепенно исчезают (рис. 2, *b*).

Если постепенно уменьшив или просто отключив поле Н, вернуться в состояние, иллюстрируемое рис. 2, а, и затем включить внешнее поле вдоль отрицательного направления оси x, то сценарий перестройки будет другим. Увеличение проекции т на направление Н в данном случае не может происходить способом, аналогичным описанному выше. Для этого было бы необходимо туннелирование вихрей через центральную поверхность доменной границы, чему препятствует потенциальный барьер, связанный с обменной энергией. Вместо этого происходит смещение верхнего вихря к верхней поверхности пленки, а нижнего — к нижней (рис. 2, с) с уменьшением их размеров. В поле порядка -1.35 · 10<sup>4</sup> А/т дальнейший рост абсолютного значения  $\langle m_x \rangle$  с сохранением вихревых структур становится невозможен и распределение М перестраивается в получающееся из изображенного на рис. 2, *b* с помощью преобразования  $x \to -x$ ,  $m_x \to -m_x$ ,  $m_z \to -m_z$ . Если теперь уменьшать модуль Н до нуля, стенка перестраивается по сценарию, обратному описанному в предыдущем абзаце, и приходит к распределению, которое получается преобразованием  $x \to -x$ ,  $m_x \rightarrow -m_x, m_z \rightarrow -m_z$  от рис. 2, *а*. Перемагничивание такой структуры в положительном направлении х пойдет теперь по сценарию со смещением вихрей к поверхностям пленки и формированием распределения М, аналогичного рис. 2, с.

На рис. З изображена рассчитанная кривая  $\langle m_x \rangle (H)$ , существенным образом отличающаяся от полученной в [3,4]. Видно, что согласно расчетам описанный выше гитерезис перестройки структуры доменной границы приводит к гистерезису кривой намагничивания. Хотя этот гистерезис невелик, тем не менее он имеет принципиальное значение, поскольку возникает в кристалле в магнитном поле, перпендикулярном ОЛН, когда согласно классическим одномерным моделям распределений намагниченности он вообще должен отсутствовать.

Следует заметить, что в пленках с теми же параметрами, но с меньшей толщиной (50 nm, 100 nm), в которых стабильны одновихревые



**Рис. 3.** Кривая намагничивания  $\langle m_x \rangle$  (*H*), соответствующая данным рис. 2.

стенки [5], согласно расчетам перемагничивание в направлении x происходит так же, как в [3,4] для одноосных пленок. В этом случае сценарии перестройки структуры доменной границы для H > 0 и H < 0 эквивалентны.

Таким образом, впервые исследована перестройка структуры асимметричной двухвихревой доменной стенки в магнитно-трехосной пленке с госсовской ориентацией поверхности во внешнем поле, ориентированном в плоскости пленки перпедикулярно ОЛН. Данная перестройка имеет новые черты по сравнению с исследованной ранее для случая одновихревых стенок. Следует заметить, что согласно [6] при дальнейшем увеличении толщины пленки стабильными становятся конфигурации намагниченности с еще большим количеством вихрей. В поведении таких структур во внешнем магнитном поле, вероятно, могут быть обнаружены новые особенности процесса перемагничивания в направлении, перпендикулярном ОЛН.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-02-00931 и ОФН РАН 12-Т-2-1007.

## Список литературы

- [1] La Bonte A.E. // J. Appl. Phys. 1969. V. 40. P. 2450-2458.
- [2] Chapman J.N., Morrison G.R., Jacubovics J.P., Taylor R.A. // JMMM. 1985.
  V. 49. P. 277–285.
- [3] Yuan S.W., Bertram H.N. // Phys. Rev. B. 1991. V. 22. P. 12 395-12 405.
- [4] Филлипов Б.Н., Дубовик М.Н. // ЖТФ. 2008. Т. 78. В. 10. С. 110–116.
- [5] Korzunin L.G., Filippov B.N., Kassan-Ogly F.A., Chaikovsky I.A. // JMMM. 2006.
  V. 298. P. 1–6.
- [6] Филиппов Б.Н. // ФТТ. 2008. Т. 50. В. 4. С. 644–649.